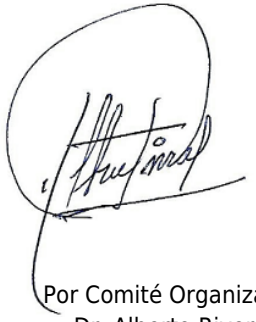
5° Congreso Argentino de Microscopía SAMIC

SAMIC

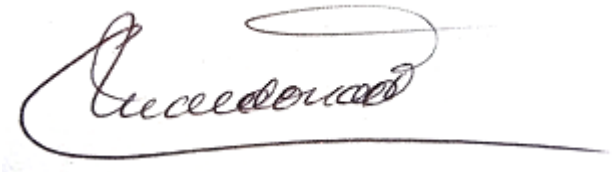
Certificamos que

Lionel Sebastian VEIGA

ha asistido y aprobado el curso **Caracterización de Superficies mediante Microscopía de Fuerza Atómica**, realizado en el 5° Congreso Argentino de Microscopía SAMIC, entre el 14 al 15 de Mayo de 2018, con una carga horaria de 16 horas.
La Falda - Córdoba - Argentina.



Por Comité Organizador:
Dr. Alberto Riveros



Por Comité Organizador:
Dra. Cristina Maldonado